

ICS 37.020  
N 33



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15246—2002  
代替 GB/T 15246—1994

---

## 硫化物矿物的电子探针定量分析方法

Quantitative analysis of sulfide minerals by electron probe microanalysis

2002-11-11 发布

2003-06-01 实施

---

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

## 前 言

本标准代替 GB/T 15246—1994。

本标准是对 GB/T 15246—1994 的修订。本次修订增加与调整了部分技术内容。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国地质科学院成都矿产综合利用研究所。

本标准主要起草人：毛水和。

本标准于 1994 年 10 月首次发布。

# 硫化物矿物的电子探针定量分析方法

## 1 范围

本标准规定了用电子探针进行硫化物矿物定量分析的标准方法。

本标准适用于在电子束轰击下稳定的硫化物以及砷化物、锑化物、铋化物、碲化物、硒化物的电子探针定量分析。

本标准适用于以 X 射线波长分光谱仪进行的定量分析；其主要内容和基本原则也适用于以 X 射线能谱仪进行的定量分析。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15074 电子探针定量分析方法通则

## 3 术语和定义

### 3.1

**硫化物矿物 sulfide minerals**

由硫构成阴离子团的金属矿物。

### 3.2

**光片 polished section**

将岩石或矿石样品切割成一定大小，并将待观测面磨平、抛光的试样。

### 3.3

**光薄片 polished thin section**

将岩石或矿石样品切割成一定大小，减薄至能透过光线，并双面磨平、抛光的试样。

### 3.4

**砂光片 slade grains**

将颗粒样品镶嵌在导电或非导电的镶嵌物中或制在玻璃薄片上并进行磨平抛光的试样。

### 3.5

**谱线重叠 spectrum overlap**

样品中不同元素的某些特征 X 射线之间所存在的一定程度的谱峰重叠的现象。

### 3.6

**重叠因子 overlap factor**

为了校正因试样中某些元素之间存在谱线重叠而造成被分析元素真实含量改变而建立起来的试验数值（因子）。

## 4 仪器设备

——电子探针仪；